

Introduction



- tous les semi-conducteurs usuels contiennent des jonctions PN
- l'étude des propriétés de ces jonctions est fondamentale
- buts du chapitre : complément de ELEC-H-301
 - bandes d'énergie
 - conductivité intrinsèque et extrinsèque
 - les principales formules (approchées)
- hypothèses simplificatrices pour ramener le problème à une dimension

©		
ULB \star Ebeams	ELEC-H-402/02 : Jonction PN	CH02_JonctionPN_d36.shw 08-01-14 13 :50:19

3





Pour fabriquer une jonction PN, on dope un monocristal unique de silicium en utilisant des donneurs du coté (N) et des accepteurs de l'autre (P). Entre les deux, se forme une zone de transition très mince dont nous allons expliquer la formation.

Accolons par la pensée deux barreaux P et N, formant ainsi une jonction abrupte ⁽¹⁾. La frontière entre les deux zones est appelée **jonction métallurgique**.

Il existe dès lors à la frontière un gradient de concentration élevé pour les deux types de porteurs (chacun étant majoritaire dans sa région et minoritaire dans l'autre). Un tel gradient engendre un phénomène de **diffusion** qui tend à égaliser les concentrations en déplaçant les porteurs vers la région où ils sont minoritaires. Ce phénomène ne peut pas être permanent car il n'y a pas de source ni de circuit fermé, ce sera un bref transitoire. En effet, on va assister à des recombinaisons entre électrons et trous à la frontière et donc

- une mince tranche de la région P ne contient plus que des atomes de Si neutre et des dopants accepteurs ionisés négativement
- une mince tranche de la région N ne contient plus que des atomes de Si neutre et des dopants donneurs ionisés positivement

Les largeurs de ces tranches s'accroissent. Les charges fixes qu'elles contiennent créent très rapidement un champ électrique E (et donc une différence de potentiel), qui s'oppose au déplacement des électrons et des trous. On finit donc par atteindre un état d'équilibre où tout déplacement macroscopique de charges est stoppé, et où la mince zone chargée de part et d'autre de la jonction cesse de s'élargir.

Cette zone est désignée par plusieurs synonymes :

- zone de charge d'espace pour indiquer la présence de ces charges fixes
- zone déplétée ou à déplétion pour indiquer l'absence de charges mobiles
- zone de transition

⁽¹⁾ En pratique, la concentration en dopants aux alentours de la frontière P-N ne varie pas de manière aussi brutale, mais suit un profil bien précis que nous négligerons ici. (voir cours de micro-électronique)



L'apparition du champ électrique engendre une différence de potentiel entre les régions P et N, qui se marque par une inclinaison des bandes d'énergie dans la zone de charge d'espace.

Au moment où le haut de la bande de conduction N correspond au bas de la bande de conduction P (et où le bas de la bande de valence P correspond au haut de la bande de valence N), les porteurs majoritaires ne peuvent plus diffuser et le déplacement macroscopique de charges s'arrête.

Ce diagramme énergétique montre bien que cette inclinaison des bandes d'énergie constitue

- une barrière de potentiel pour les majoritaires des deux régions qui ont donc tendance à rester dans leur région, à moins que l'agitation thermique ne confère à un petit nombre d'entre eux assez d'énergie pour franchir la barrière
- un toboggan de potentiel pour les minoritaires des deux régions, qui sont aspirés vers l'autre région dès qu'ils passent au voisinage de la jonction



Dans les zones où il y a des porteurs mobiles, le champ électrique est nul, comme on l'a vu au chapitre précédent. Par contre, dans la zone de transition, il n'y a que des ions fixes des dopants qui créent une charge d'espace macroscopique. Par application de l'équation de Poisson, ces charges sont responsables de l'apparition d'un champ électrique E, qui lui-même dérive d'un potentiel V.

Remarquons que la **zone de charge d'espace doit être globalement neutre**, puisque l'ensemble du cristal l'est, et que chacune des régions hors zone de transition l'est également.

En supposant un profil de dopage constant dans chaque région et une jonction abrupte, on arrive à une représentation simplifiée à une dimension, où champ et potentiel ne dépendent plus que de x.

L'intégrale de la densité de charge négative constante de la région P fournit un champ électrique qui croît négativement pour atteindre son maximum à la jonction métallurgique; vu la définition du sens positif de E, ce champ repousse vers la gauche les trous (majoritaires) de la région P.

Dans la région N l'intégration des charges positives ramènera E à 0 à la limite droite de la zone de transition. Le champ est toujours de même signe, donc il repousse vers la droite les électrons (majoritaires) de la région N

Par définition le niveau d'énergie est proportionnel au potentiel V pour les charges positives, c'est à dire les trous. Pour les **majoritaires** (électrons de la région N et trous de la région P), franchir la zone de transition demande donc de vaincre une **barrière de potentiel**. Les quelques rares porteurs minoritaires qui arrivent au bord de la zone de transition rencontrent un puits (toboggan) de potentiel qui la leur fait traverser rapidement.

La hauteur de la barrière de potentiel est l'aire sous le diagramme de champ électrique E .

Toutes les propriétés de la zone de transition (longueurs, champ, barrières de potentiel) résultent d'un équilibre thermodynamique qui dépend de la température et du matériau de base (voir cours de physique du semi-conducteur). Par exemple la barrière de potentiel vaut :

-	pour le silicium	(Si)	0,8	۷	à	20 °C	et	0.64V	à	100°C
-	pour le germanium	(Ge)	0,3	V	à	20 °C	et	0.22V	à	100°C
-	pour l'arséniure d	le gallium (AsGa)	1.22	27	à	20°C	et	1.07V	à	100°C

La longueur de la zone de transition et proportionnelle à la racine carrée de la barrière de potentiel Vo (le démontrer à titre d'exercice)



La zone de transition d'une jonction PN est donc traversée en permanence par des charges dont le sens de déplacement réel est donné sur la figure du bas.

Les vecteurs des courants correspondants (sur la figure du haut) sont définis positifs dans le sens conventionnel (sens des charges positives).

Les vecteurs de courant sont donc dans le même sens que le mouvement des trous et dans le sens opposé au mouvement des électrons.

L'indice p correspond aux trous et l'indice n aux électrons.

L'indice **f** correspond à un courant direct (*forward*) c'est-à-dire traversant la jonction dans le sens P=>N L'indice **r** correspond à un courant inverse (*reverse*) c'est-à-dire traversant la jonction dans le sens N=>P

Les mouvements des deux types de charges dans les deux sens créent donc 4 courants qui traversent en permanence la zone de transition.

J_{pf} et J_{nf} sont dus respectivement aux trous majoritaires de P et aux électrons majoritaires de N, qui ont assez d'énergie pour franchir la barrière de potentiel.

J_{pr} (J_{nr}) est dû au faible nombre de trous (électrons) minoritaires de N (de P) qui, par leur agitation thermique, arrivent à la frontière de la zone de transition et sont aspirés par E (ils dévalent la barrière de potentiel) ce nombre ne dépend en première approximation que de la température.

La jonction étant isolée, il n'y a aucun courant total : le courant direct et le courant inverse se compensent mutuellement, pour chaque type de porteur.

$$J_{pf} + J_{pr} = 0$$

 $J_{nf} + J_{nr} = 0$

Jonction PN PLAN ▶ jonction PN à l'équilibre jonction PN polarisée en direct et en inverse champ E et potentiel diagramme d'énergie concentration des porteurs bilan des courants caractéristique J(v) détails sur la polarisation inverse la jonction PN dissymétrique notion de durée de vie ▶ conclusions ULB 🗹 👌 beams CH02_JonctionPN_d36.shw 08-01-14 13 :50:19 ELEC-H-402/02 : Jonction PN

13



Une jonction PN isolée du mode extérieur ne présente pas le moindre intérêt. Métallisons ses extrémités et raccordons-les à une source de tension continue V _r; le pôle positif de la source est connecté à la région N. Nous envisagerons ici une amplitude de quelques V qui n'engendre aucun risque de phénomènes indésirables (voir dia 41 et suivantes : le problème d'avalanche).

La jonction est dite polarisée en sens inverse ou bloquant et nous allons voir pourquoi.

Le pôle positif de la source attire les électrons majoritaires de la région N et le pôle négatif attire les trous majoritaires de la région P. Un courant transitoire très bref apparaît, qui vide partiellement les deux régions et contribue donc à élargir la zone de charge d'espace.

Les pentes du diagramme de champ électrique étant fixées par les dopages, elles sont invariantes et la hauteur (c'est-à-dire le champ électrique maximum) croît, ainsi que la surface (et donc la hauteur de la barrière de potentiel).

Le transitoire de courant s'arrête lorsque la barrière de potentiel atteint la valeur V $_{o}+V_{r}$ qu'on peut assimiler à V $_{r}$ si V $_{r}$ >>V $_{o}$, ce qui est souvent le cas.

Ce phénomène est analogue à la charge d'un condensateur.

L'absence de courant en régime explique l'appellation "sens bloquant".

REM : en réalité, il existe un très faible courant de fuite que nous allons analyser plus tard (voir dias 47 et suivantes).



Renversons la source de tension extérieure en connectant son pôle positif à la région P, on parle de **polarisation directe** ou en **sens passant**.

Nous envisagerons une tension directe comprise entre 0 et le voisinage de la barrière de potentiel V o.

Le pôle positif (négatif) de la source repousse les trous (électrons) majoritaires de la région P (N) en direction de la zone de transition, qui a donc tendance à se rétrécir. Le champ électrique maximum décroît, et la hauteur de la barrière de potentiel se réduit de la valeur de la tension extérieure appliquée, favorisant ainsi le passage des courants de majoritaires à travers la jonction.

L'effet d'une augmentation de la tension directe est plus que proportionnel sur ces courants de majoritaires, car deux phénomènes coopèrent :

- l'abaissement de la barrière de potentiel

- l'augmentation du niveau moyen d'énergie des majoritaires arrivant à la barrière de potentiel

REM : si l'on augmente la tension directe appliquée au-delà de V o le comportement de la jonction change.

- nous admettrons, sans le démontrer, que la zone de transition conserve une largeur minimum
- le courant est essentiellement déterminé par la résistance du silicium et non plus par les propriétés de la jonction. (voir chapitre suivant sur la diode)



Les **courants inverses** (indice **r** pour *reverse*) sont liés aux **porteurs minoritaires** et circulent quelle que soit l'amplitude de la tension inverse appliquée ; ils ne dépendent à priori que de la densité de minoritaires parvenant au bord de la zone de transition, c'est-à-dire de la température.

Les **courants directs** (indice **f** pour *forward*), constitués de **porteurs majoritaires**, sont fortement influencés par la tension directe appliquée, comme le montrait la dia précédente :

- en polarisation directe, les courant direct croissent fortement et le courant total devient direct et important
- en polarisation inverse, les courants directs baissent et donc le courant total devient inverse et reste faible

REM : nous verrons ultérieurement au chapitre sur la tenue en tension que le courant inverse croît très faiblement lorsque la tension inverse appliquée augmente.



En l'absence de polarisation, les concentrations de porteurs majoritaires sont fixées par la densité des dopants et celle des minoritaires par la loi pn = n_i^2 .

Vu les différences d'ordre de grandeur, la représentation logarithmique (figure de gauche) convient le mieux. La représentation linéaire (figure de droite) ne peut pas être faite à la même échelle pour les majoritaires et les minoritaires, d'où la coupure dans le dessin.

Les côtés P et N sont rarement dopés de manière symétrique. Nous envisagerons ici une faible différence de dopage. Le cas d'une jonction fortement dissymétrique sera vu plus tard.



Dans cette figure, le premier indice désigne le type de porteur et le deuxième indice désigne soit la région considérée (P ou N), soit la valeur d'équilibre en l'absence de polarisation (indice o).

Si l'on polarise la jonction en appliquant une tension extérieure v, on admettra que les concentrations sont modifiées aux frontières de la zone de transition.

Une tension appliquée v positive correspond à une polarisation directe.

En polarisation directe (inverse) apparaissent des **excès** (défauts) **de porteurs minoritaires** notés δ_{pn} = excès de minoritaires (trous) dans la région N

 δ_{np}^{pn} = excès de minoritaires (électrons) dans la région P

Ces excès (défauts)

- sont proportionnels à la concentration de minoritaires à l'équilibre correspondante (p $_{no}$ ou n_{po}) - dépendent d'une fonction exponentielle de v/V $_{T}$ où

v est la tension appliquée aux bornes de la jonction

V_T = kT/e est une constante dépendant de la température et qui vaut environ 25mV à 20 °C

En raison de l'électro-neutralité apparaissent des excès (défauts) de majoritaires identiques

$$\delta_{nn} = \delta_{pn}$$
 et $\delta_{pp} = \delta_{np}$

En règle générale,

les excès de porteurs minoritaires ne sont pas négligeables devant les concentrations de minoritaires
les excès de porteurs majoritaires sont négligeables devant les concentrations de majoritaires

Ex : si $\delta_{np}/n_{po} = 10$ et que $p_{po}/n_{po} = 1E+10$ alors $\delta_{pp}/p_{po}=1E-09$

REM : On verra au cours d'électronique de puissance que, dans les semi-conducteurs spéciaux adaptés à des tensions et courants élevés, on peut atteindre des excès non négligeables de majoritaires. Pour les composants étudiés dans ce cours-ci, on négligera toujours les excès de majoritaires.



L'échelle logarithmique représente bien la différence d'importance relative entre l'excès de minoritaires et l'excès de majoritaires.

La jonction est représentée très légèrement dissymétrique, la région P étant un peu plus dopée que la région N.



En régime stationnaire, une polarisation externe constante entretient un excès constant de minoritaires aux deux frontières de la zone de transition. Lorsque l'on pénètre dans les régions P et N, en s'éloignant de la zone de transition, les lois de la diffusion s'appliquent et l'**excès de porteurs décroît exponentiellement** avec une **longueur caractéristique L**_p (L_n), propre à chaque type de porteur.

L_p et L_n sont appelées **longueur de diffusion**.

Elles varient de 1µm à quelques dizaines de µm pour le Silicium, en fonction de la pureté du cristal. Nous verrons dans la suite de ce chapitre que la longueur de diffusion dépend d'autres paramètres caractéristiques.

ATTENTION! ne pas confondre avec L_a et L_d qui sont les longueurs de zones déplétées de la jonction PN



29

La loi de Fick démontre qu'un gradient de concentration de porteurs engendre un courant de diffusion - qui lui est proportionnel

- dont le sens tend à réduire le gradient qui en est la cause

Prenons le cas de la région N : la concentration p de trous minoritaires présente un gradient dp/dx _n négatif qui engendre un courant de diffusion positif suivant l'axe des x _n. Ce courant transporte des trous de gauche à droite, ce qui a bien tendance à diminuer la concentration à gauche et à l'augmenter à droite, et donc à réduire le gradient. Si un gradient stationnaire se maintient, c'est à cause de la source de tension externe qui entretient l'excès $\delta_{pn}(x_n=0)$.

Dans la région P, un raisonnement similaire conduit à un déplacement d'électrons de droite à gauche sur la figure, et donc à un courant conventionnel dans le sens opposé.

Les fonctions d'excès δ étant exponentielles en fonction de x, les courants de diffusion, proportionnels à leur dérivée spatiale, évoluent également suivant des exponentielles.

Les constantes D_p et D_n sont les **coefficients de diffusion**. Nous admettrons la relation d'Einstein, qui montre que D_p et D_n sont **proportionnels aux mobilités** μ_p et μ_n . Les courants de diffusion se répartissent donc dans la même proportion que les courants de conduction. Pour le Si le rapport est d'environ 3/1 en faveur des électrons.



En faisant l'hypothèse que l'on peut **négliger les recombinaisons**, y compris dans la zone de transition qui est très mince en polarisation directe, on aboutit à une conservation des porteurs : la somme des densités de courant se conserve en chaque point des deux régions P et N.

À plus de 5 longueurs de diffusion de la zone de transition, les excès de porteurs ont diminué de 99% ; les densités de porteurs sont donc pratiquement constantes et les courants de diffusion sont nuls. Restent uniquement les courants de conduction des porteurs majoritaires.

Lorsque l'on se rapproche de la zone de transition, les gradients de densité dus aux excès de charges créent des courants de diffusion.

De gauche à droite on a :

- au sein du métal un déplacement d'électrons de droite à gauche
- au passage métal-P, ce déplacement d'électrons se conserve dans la bande de valence => déplacement de trous majoritaires de gauche à droite; le courant de minoritaires est négligeable
- à l'approche de la jonction se crée un excès de trous et d'électrons, toujours croissant vers la droite, et donc un déplacement d'électrons et de trous de droite à gauche tendant à combattre ce gradient. Ce phénomène de diffusion affaiblit le courant de majoritaires et renforce le courant de minoritaires, ce qui maintient le courant total constant. Dans l'hypothèse d'une jonction symétrique au niveau des dopages, les excès de trous et d'électrons sont égaux et le courant de diffusion des électrons vaut 3 fois celui des trous, ce qui
- le passage de la zone de transition conserve par hypothèse la valeur des courants. Dans cette zone, il n'y a
 pas de gradient de concentration, donc pas de diffusion. Les courants sont de conduction et dans le rapport
 des mobilités, le courant d'électrons vaut donc le triple du courant de trous
- un raisonnement symétrique conduit à un retour progressif vers un courant purement d'électrons majoritaires au fur et à mesure que l'on pénètre dans la région N

Calcul du courant total

on se ramène au calcul des courants de diffusion

On doit sommer les courants de trous et d'électrons.

$$J_{tot} = J_{pp}(x_p=0) + J_{np}(x_p=0) = J_{nn}(x_n=0) + J_{pn}(x_n=0)$$

hypothèse de non-recombinaison dans la zone de transition

$$J_{pp}(x_p=0) = J_{pn}(x_n=0)$$
 et $J_{nn}(x_n=0) = J_{np}(x_p=0)$



Pour calculer le courant total traversant la jonction, on doit sommer les courants de trous et d'électrons. Par hypothèse de non-recombinaison dans la zone de transition, J_{pp} et J_{nn} se conservent en la traversant; on obtient donc pour le courant total une expression qui ne dépend plus que des courants de minoritaires, donc des courants de diffusion, que nous allons calculer par la loi de Fick.



35

Intéressons-nous au courant de diffusion des électrons dans la région P.

L'excès d'électrons

 $\delta_{np}(x_p)$

est une fonction dont la valeur à l'origine $\delta_{np}(x_p=0)$ dépend exponentiellement du terme v/V T où

v est la tension appliquée sur la jonction

V_T = kT/e est une constante ayant les dimensions d'une tension traduisant l'influence de la température

La densité de courant à la frontière de la zone de transition J $_n(x_p=0)$ s'en déduit aisément par dérivation et comprend un terme direct J $_{nf}$ dépendant exponentiellement de la tension appliquée sur la jonction et un terme inverse constant J $_{nr}$.

Le calcul est évidemment symétrique pour le courant de diffusion des trous dans la région N.

Le courant total est la somme des deux contributions.



Rappelons que $V_T = kT/e$ et vaut environ 25mV à température ambiante.

- si v>>V_T la jonction PN est passante et la caractéristique courant-tension est exponentielle, car le terme J_r courant de fuite devient négligeable
- si v<0 la jonction est bloquante et le courant de fuite est constant (=Jr). Il ne dépend que :
 - de la température qui accroît les densités de minoritaires
 - des dopages : plus on dope, plus on réduit les densités de minoritaires n $_{po}$ et p $_{no}$ et plus le courant de fuite diminue, puisqu'il en dépend linéairement
 - du matériau

JONCTION PIN

PLAN

► jonction PN à l'équilibre

 jonction PN polarisée en direct et en inverse

- détails sur la polarisation inverse
 - constations expérimentales
 - composition du courant inverse
 - dépendance du courant inverse avec T et V
 - phénomène d'avalanche
- Ia jonction PN dissymétrique
- notion de durée de vie
- ► conclusions

C		
ULB	e beams	ELEC-H-402/02 : Jonction PN

CH02_JonctionPN_d36.shw 08-01-14 13 :50:19

39



En pratique, le courant de fuite que l'on observe n'est pas constant :

- il augmente très légèrement avec la tension inverse
- au-delà d'une tension V_{BR}, appelée tension de claquage ou *breakdown voltage*, le courant inverse augmente extrêmement brutalement (même en échelle logarithmique !!!)
- la température aggrave sensiblement le courant de fuite.

Rem : La tension caractéristique V_{BR} dépend énormément du type de semi-conducteur : elle n'est que de quelques volts dans les circuits intégrés, pour atteindre quelques kV dans les semi-conducteurs de puissance les plus performants à cet égard. Pour la diode 1N4148 illustrée ici, V_{BR} vaut environ 100V



Si la tension inverse appliquée V_r est élevée par rapport à la tension de seuil V_o (qui vaut environ 0,8V), alors la barrière de potentiel (V_r + V_o) est essentiellement due à V_r.

L'aire sous le diagramme triangulaire du champ E est donc égale à la tension inverse appliquée. Les pentes des côtés de ce triangle étant constantes (car fixées par les dopages), le triangle doit conserver ses proportions lorsque la tension inverse varie. Les longueurs définissant la zone de charge d'espace (L_a,L_d) et leur somme (L_a + L_d), ainsi que le champ E_{max} varient donc simultanément comme la racine carrée de la tension inverse appliquée.

Exercice : établir les relations liant E $_{max}$,V $_{r}$, L $_{a}$, L $_{d}$ et les dopages N $_{a}$ et N $_{d}$



45

La jonction PN polarisée en inverse peut être modélisée en première approximation comme un **condensateur** dont **la zone de charge d'espace constitue l'isolant**, car elle ne contient quasiment pas de charges mobiles.

Les deux électrodes sont les parties conductrices, c'est-à-dire les métallisations et les régions P et N.

Ce condensateur est **fortement non linéaire** avec la tension inverse V_r appliquée à la jonction. Si V_r croît, la zone de charge d'espace s'élargit, donc les électrodes du condensateur s'écartent et sa capacité décroît.

L'ordre de grandeur de la capacité varie beaucoup d'un composant à l'autre (quelques fF pour une jonction d'un circuit intégré, quelques pF pour un composant discret de signal, quelques dizaines de nF pour un composant de puissance)



Lorsqu'on fait croître la tension inverse, un faible courant légèrement croissant avec la tension prend naissance : la courant de fuite de la jonction.

Son origine est double

- un courant de surface, lié au champ électrique important dans la zone de charge d'espace; ce phénomène est généralement bien maîtrisé par les techniques de passivation (dépôt d'un très bon isolant en surface); pour les composants de puissance soumis à des tensions inverses importantes (jusqu'à plusieurs kV), on adopte une forme en biseau, qui réduit le champ électrique en surface par allongement des lignes de fuite. De nombreuses autres techniques sont utilisées, que nous ne détaillerons pas ici.
- un courant d'origine thermique avec plusieurs composantes
 - les rares porteurs majoritaires ayant assez d'énergie pour franchir la barrière de potentiel
 - les porteurs franchissant aisément la zone de transition sous l'action du champ E
 - les porteurs minoritaires des régions P et N
 - les paires électron-trou générées par l'agitation thermique au sein de la zone de transition

La température joue donc un rôle important (surtout au-delà de 100 °C), car elle augmente la densité de tous les types de porteurs.

La contribution des majoritaires devient négligeable lorsqu'on augmente la tension inverse, parce que cela rehausse la barrière de potentiel. La légère augmentation du courant inverse avec la tension inverse ne peut donc s'expliquer que par les minoritaires.



L'énorme dépendance de la densité de courant de fuite avec la température apparaît clairement, avec une croissance d'un facteur 1000 entre 25 °C et 140°C.

La contribution des porteurs minoritaires (issus par définition des régions p et n) ne dépend pas de la tension car le champ électrique est toujours suffisant pour leur faire franchir la zone de transition.

La dépendance du courant de fuite avec la tension vient alors de la variation de la quantité de **paires électron trou** générées thermiquement au sein même de la zone de transition. La génération G(T) s'exprime en paires générées par unité de volume et de temps. La quantité de paires générées par unité de temps est donc proportionnelle au **volume** de la zone de transition, donc à sa longueur, donc à la racine carrée de la tension inverse appliquée (voir précédemment).



A gauche de la figure nous voyons un électron créé au sein du cristal et accéléré par le champ dans la zone de charge d'espace. Avant de heurter un atome du cristal, il parcourra statistiquement une distance moyenne L_{moy} appelée libre parcours moyen; il acquiert pendant ce parcours une énergie ΔW .

Deux types de collisions sont possibles:

- soit l'énergie acquise est en partie transférée au réseau cristallin sous forme de chaleur

- soit l'énergie est suffisante (environ 3,5eV dans le Si) pour créer une nouvelle paire électron-trou

Dans ce cas, les nouvelles charges sont à leur tour accélérées et ont elles-mêmes une certaine probabilité d'acquérir assez d'énergie pour créer une nouvelle paire à leur prochaine collision.

Cet **effet "boule de neige**" est appelé **avalanche** et la tension à laquelle il se produit "**tension d'avalanche**" ou "**tension de claquage**" ou "*breakdown voltage*" d'où la notation V_{BR}.

On conçoit donc aisément que l'accroissement de E augmente l'énergie acquise par les charges et favorise directement l'avalanche. Par souci de simplification, on parle souvent d'une valeur critique de champ E _{crit} (de l'ordre de 20.10^6 V/m soit 20V/µm), au-delà de laquelle l'avalanche se produit. En réalité, nous allons voir dans les dias suivantes que le seuil critique n'est pas uniquement lié à l'amplitude de E.

Avalanche



Coefficients d'ionisation

 $\alpha_n = a \exp(-b/E)$ paire créée / électron / m $\alpha_p = \gamma \exp(-b/E)$ paire créée / trou / m

Coefficients de multiplication



En réalité la limite d'avalanche est plus complexe et fait intervenir :

la longueur de la zone de charge d'espace, elle-même fonction de la tension inverse appliquée
des coefficients d'ionisation :

α_p = nombre de paires électron-trou créées par trou incident et par unité de longueur dans la direction du champ E

 α_n = nombre de pair électron-trou créé par électron incident et par unité de longueur dans la direction du champ E

Ces coefficients sont de la forme:

 $K_p = A \exp(-B/E)$ et $K_n = C \exp(-B/E)$ où A, B et C sont des constantes

Soit L la longueur de la zone de charge d'espace. Considérons une paire électron-trou engendrée à l'abscisse x. Le trou sera accéléré en direction de la région P et créera, en moyenne, sur une longueur dx, un nombre de paires secondaires K_p .dx. Il en sera de même pour l'électron aspiré vers la région N, avec création de K _n.dx paires secondaires à chaque progression de dx. Le nombre total de paires créées résulte alors d'une intégrale sur la longueur L.

Cette augmentation de charges mobiles est traduite par des coefficients de multiplication donnant:

- les rapports M_n (M_p) entre les densités de courant d'électrons (de trous) sortant à une extrémité de la jonction et les densités de courant de porteurs minoritaires incidents à l'autre extrémité.
- la multiplication M_c des paires électron-trou suite à la génération au sein de la zone de charges d'espace, qui donnerait une densité J_{co} sans avalanche.

L'expression de ces coefficients comprend au dénominateur une intégrale dépendant des coefficients d'ionisation $\alpha_n(E(x))$ et $\alpha_p(E(x))$. Lorsque la tension inverse appliquée croît, E(x) croît partout dans la zone de charge d'espace et donc $\alpha_n(E(x))$ et $\alpha_p(E(x))$ également. Le dénominateur des 3 coefficients M_i finit par s'annuler ce qui marque l'apparition d'une **instabilité**.



Les trois coefficients multiplicatifs M_n,M_p et M_c tendent simultanément vers l'infini: c'est l' avalanche.

La jonction PN ne limite plus le courant, elle devient plutôt une source ¹ (chute) de tension de valeur V_{BR} et de très faible impédance de sortie. Le courant n'est alors plus limité que par l'impédance du circuit extérieur Z_{ext}, qui dans beaucoup de montages est également petite, parce que c'est celle de la source de tension inverse V_r et des fils de câblage. Le point de fonctionnement est à l'intersection de la caractéristique de la jonction en avalanche et du circuit extérieur

 $V = -V_r - Z_{ext}$. I

Soit $I_{\text{lim,ext}}$ cette valeur limite de courant.

L'avalanche n'est pas destructrice en elle-même, mais engendre un échauffement important dû à la puissance dissipée

 $P_{BR} = V_{BR}$. $I_{lim,ext}$

qui peut **dégrader la jonction** de manière irréversible (migration de dopants) voire même engendrer la fusion du silicium.

Il existe une relation empirique permettant de donner une valeur approchée du coefficient de multiplication du courant de fuite et dont l'exposant doit être ajusté en fonction du semi-conducteur.

¹ ce n'est pas une source au sens d'une force électromotrice, mais bien une différence de potentiel

|--|

PLAN

	jonction	PN	<u>S</u>	l'équilibre
--	----------	----	----------	-------------

Jonction	PN	polarisée	en	direct	et	en
inverse						

- détails sur la polarisation inverse
- Ia jonction PN dissymétrique
 - zone de transition
 - tenue en tension
 - injection de porteurs minoritaires
 courant traversant la jonction
- notion de durée de vie
- ▶ conclusions

C		
ULB	\checkmark	beams

ELEC-H-402/02 : Jonction PN

CH02_JonctionPN_d36.shw 08-01-14 13 :50:19

57



Si l'une des régions est sensiblement moins dopée que l'autre, l'électro-neutralité de la zone de transition impose que celle-ci s'étende principalement du côté le moins dopé.

C'est une constatation très importante car elle joue un rôle fondamental dans le fonctionnement et la tenue en tension de la plupart des dispositifs à semi-conducteurs, et constitue le principe des transistors JFET (Junction Field Effect Transistor).



Pour une même tension inverse appliquée (c'est-à-dire une même surface du triangle de champ E), le fait de diminuer le dopage d'un côté de la jonction augmente la longueur de la zone de transition et diminue donc la valeur maximum du champ E_{max}.



Exercice: établir les formules détaillées, puis les formules simplifiées (en négligeant N _d devant N_a).

Jonction Pl	N dissymétrique en pol. inv	erse
🗷 tenue	e en tension inverse : 🛰 dopage	
• diminuer le dop • augmente L_d : • le volume de l • la quantité de • $\int \alpha(E(x))$ sur ur • diminue E_{max} : • moindre énerg • est globalemer	page N _d effet défavorable la zone de transition augmente paires électron-trou thermiques au ne plus grande longueur effet favorable gie acquise sur libre parcours moyent très favorable	gmente en
pour augmen dissymétrise fortement le	nter la tension d'avalanche, il fau er la jonction PN en diminuant dopage d'une des deux régions	It
[©] ULB 🗹 Jeams	ELEC-H-402/02 : Jonction PN	CH02_JonctionPN_d36.shw 08-01-14 13 :50:19
 Il n'est pas évident a priori qu'une d d'avalanche, car elle engendre deu un effet défavorable dû à l'allong le volume, donc la quantité de la longueur du trajet des char un effet favorable par la diminut lors du libre parcours moyen. En pratique, c'est de loin le deuxièm un abaissement du dopage d'un des 	liminution du dopage soit la solution pour augmenter la te ex effets antagonistes : gement de la zone de transition, ce qui en augmente e paires générées rges, donc le nombre de collisions tion de la valeur maximale du champ E _{max} , ce qui réduit l'é me effet qui l'emporte et la tenue tension inverse est toujours s deux côtés de la jonction.	ension nergie acquise s améliorée par



La figure de gauche illustre une jonction dopée symétriquement. Pour passer à la figure de droite, on diminue le dopage N_d de la région N d'un facteur **q** (égal à 10³ sur cet exemple). Il en résulte que :

- on divise par **q** la concentration de majoritaires **n**_{no.} puisqu'ils viennent presque exclusivement des dopants
- on multiplie par **q** la concentration de minoritaires \mathbf{p}_{no} , puisque p_{no} . $n_{no}=n_i^2(T)$
- on multiplie par q l'excès de minoritaires δ_{pn} engendré par la polarisation directe à la frontière entre la région N et la zone de transition, puisque cet excès est proportionnel à p _{no}
- rien n'est changé pour la région P et donc l'excès de minoritaires δ_{pn} de la région la moins dopée devient **q** fois plus important que l'excès de porteurs minoritaires δ_{np} dans la région la plus dopée

Avec les valeurs numériques de cette figure (q = 10³)

Pour les minoritaires

$$p_n = p_{no} + \delta_{pn} = 10^{12} + 10^{13} \approx 10^{13} [m^{-3}]$$
(1)

$$n_p = n_{po} + \delta_{np} = 10^9 + 10^{10} \approx 10^{10} [m^{-3}]$$
(2)

Pour les majoritaires l'électro-neutralité impose $\delta_{pp} = \delta_{np}$ et $\delta_{nn} = \delta_{pn}$

$$p_p = p_{po} + \delta_{pp} = 10^{24} + 10^{10} \approx 10^{24} \text{ [m}^{-3]}$$
(3)

$$n_n = n_{no} + \delta_{nn} = 10^{21} + 10^{13} \approx 10^{21} \text{ [m}^{-3]}$$
(4)

La dissymétrie du dopage engendre donc

- un afflux de porteurs minoritaires considérable dans la région la moins dopée que l'on appelle l'injection de porteurs minoritaires
- (2) un excès de minoritaires beaucoup plus faible du côté le plus dopé
- (3) aucun changement significatif de porteurs majoritaires du côté p
- (4) aucun changement significatif de porteurs majoritaires du côté n

L'injection joue un rôle fondamental dans de nombreux types de composants.



La dissymétrie du dopage change la composition du courant qui traverse la jonction.

Si la jonction est symétrique, les excès de porteurs sont identiques, donc les courants de diffusion sont dans le rapport 3/1 en faveur des électrons. Il en va de même pour les courants de conduction au sein de la zone de transition où 75% du courant provient des électrons.

Prenons une jonction dissymétrique où l'on réduit fortement le dopage de la zone N

- le grand excès de porteurs minoritaires dans la région peu dopée N augmente le courant de diffusion des minoritaires (J_{pn} sur la figure en bas à droite) et réduit le courant des majoritaires J_{pn}.
- l'hypothèse de non-recombinaison des porteurs dans la zone de transition montre que le courant dans la zone de transition (et dans la région la plus dopée) est essentiellement composé de porteurs majoritaires (J pp sur la figure) issus de la région la plus dopée

La répartition des courants peut donc être complètement modifiée par la dissymétrisation des dopages

Jonction PN

PLAN

- ▶ jonction PN à l'équilibre
- jonction PN polarisée en direct et en inverse
- détails sur la polarisation inverse
- Ia jonction PN dissymétrique

notion de durée de vie

► conclusions

0		
ULB	\checkmark	e beams

ELEC-H-402/02 : Jonction PN

CH02_JonctionPN_d36.shw 08-01-14 13 :50:19

71



En polarisant une jonction en sens direct par une tension v constante, on obtient un état de régime où l'on entretient les excès de porteurs à la frontière de la zone de transition. Nous avons déjà vu que, lorsque l'on s'éloigne de la zone de transition, ces excès décroissent exponentiellement avec une longueur caractéristique

Si l'on cesse de polariser en ramenant v à 0 à l'instant t=0, on retourne vers un autre état d'équilibre, où les excès de porteurs auront disparu. On montre que, en tout point du semi-conducteur, l'excès de porteurs décroît exponentiellement avec le temps. La constante de temps de l'exponentielle est appelée durée de vie des porteurs minoritaires. Les durées de vie des électrons et des trous sont différentes.

Il y a donc trois paramètres caractéristiques de la diffusion (l'indice donne le type de porteur)

- la longueur de diffusion (L_p,L_n)

appelée longueur de diffusion.

- la durée de vie des minoritaires (τ_p, τ_n)
- les constantes de diffusions (D_p, D_n)

En réalité, seuls deux paramètres sont indépendants, car ils sont liés par une relation du type L²=D. τ Rappelons en outre que la constante de diffusion D est liée à la mobilité par

ce qui introduit de nouveau la température comme une grandeur d'influence importante.

Durée de vie des porteurs minoritaires				
	propriétés principales			
 influence sur la ra bloqué → passan injection de porte passant → bloqué disparition progre => délais cruciaux en électronique d en logique bipola τ = de 10µs à qq 	apidité de commutation t = allumage (synonyme : mise e eurs = création d'une charge é (synonymes : extinction ou bloc essive de la charge injectée de puissance ire 10μs (Si peu dopé)	n conduction) age)		
 t × si purete × distorsion du crist 	al = centre de recombinaison			
 on peut diminuer irradiation avec d dopage par Au or REM: recombinaiso 	τ en fabrication jusqu'à qq 10ns les protons ou des électrons u Pt ons radiatives = des durées de vie t	rès faibles (ns)		
	ELEC-H-402/02 : Jonction PN	CH02_JonctionPN_d36.shw 08-01-14 13 :50:19		
75				

La durée de vie est un paramètre très important de la rapidité du passage d'une jonction de l'état passant à l'état bloqué. La disparition (apparition) des porteurs injectés prend un certain temps qui retarde donc le blocage (la mise en conduction) de la jonction par rapport au moment où l'on coupe (applique) la polarisation. Cet effet est particulièrement sensible dans les composants électroniques de puissance et les circuits logiques bipolaires, et en limite la fréquence de fonctionnement. Pour du Si faiblement dopé, on a une durée de vie de l'ordre de 10 microsecondes à quelques dizaines de microsecondes.

C'est la **pureté du cristal** qui détermine principalement la durée de vie. On peut l'influencer lors de la fabrication, notamment en irradiant le cristal avec des protons ou des électrons ou en dopant par de l'or ou du platine, ce qui introduit des centres de recombinaison. On peut alors descendre de 10 µs à quelques dizaines de ns.

REM: les recombinaisons radiatives correspondent à des durées de vie très faibles (ns).

Ionction PN	
► jonction PN à l'équilibre	
jonction PN polarisée en direct et en inverse	
détails sur la polarisation inverse	
la jonction PN dissymétrique	
notion de durée de vie	
conclusions	
ULB Ceeams ELEC-H-402/02 : Jonction PN	CH02_JonctionPN_d36.shw 08-01-14 13 :50:19

Conclusions

porteurs minoritaires

- on peut créer des excès de minoritaires
 - au voisinage de la zone de transition
 - décroissant en exp(x/L_{n,p}) c-à-d significatifs sur une longueur égale à quelques fois la longueur de diffusion
 - dépendant exponentiellement de la tension appliquée
 - très importants si la jonction est dissymétrique (injection de porteurs minoritaires)
- l'excès de minoritaires est important parce que significatif devant les minoritaires
- I'excès de majoritaires = excès de minoritaires mais insignifiant devant les majoritaires
- les excès de porteurs survivent en exp(-t / \u03c0_{p,n}) à leur cause, c-à-d pendant quelques fois leur durée de vie

ULB 🗹 蓤

Conclusions

courants

- Ie courant possède deux origines
 - la conduction (mouvement de charges dû à E)
 - la diffusion due aux gradients spatiaux dp/dx et dn/dx liés aux excès créés par la polarisation
- Ie courant se conserve en tout point, mais sa composition varie
 - les courants de diffusion cessent d'être significatifs lorsque l'on s'éloigne de la zone de transition de quelques longueurs de diffusion
- Ia température augmente tous les courants

©		
	ELEC-H-402/02 : Jonction PN	CH02_JonctionPN_d36.shw 08-01-14 13 :50:19
	79	

Conclusions

importance de la jonction PN

- le rôle de "vanne électronique" des semiconducteurs est lié au comportement à deux visages de la jonction
 - conductrice si polarisée en direct par une tension v_f
 - dépendance exponentielle J(v_f)
 - seul v_f <V_O a un sens (V_O=0.8V pour Si à 25°C)
 - bloquante si polarisée en inverse
 - très faible courant de fuite
 - avalanche si $|V| > V_{BR}$
- la jonction PN joue un rôle (principal ou auxiliaire) dans tous les semi-conducteurs